公開実用 昭和63-70149

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

母 公開実用新案公報(U)

昭63-70149

@Int_Cl.4

庁内整理番号 識別記号

❷公開 昭和63年(1988)5月11日

H 01 L G 02 F | H 05 K 21/60 1/133 1/14

6918-5F 8205-2H C-6679-5F 324

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

()

電極群の接合構造

②実 顧 昭61-164539

包田 屬 昭61(1986)10月27日

佐 母考 案 者

光 正 長野県販訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

砂出 83 セイコーエブソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

外1名 弁理士 最上 枒 砂代 理 人

明 網 書

- 1. 考案の名称 電極群の接合構造
- 2. 実用新案登録請求の範囲

半導体案子をTAB用テーブに実装した実装体を、他の電極群と接合する電極群の接合構造において、前記電磁群と接合する部分でTAB用テーブからのオーバーハング部が、電極群の外側まで伸びていることを特徴とする電極群の接合構造。

- 3. 考案の詳細な説明
- [産菜上の利用分野]

本考案は、液晶やBIを用いたデイスプレイパネル等の実装体において、多数の電極(電極群) を有する実装体の電極群同志を接合する構造に関する。

[従来の技術]

第2図から第5図で、従来の構成について液晶

-1 -

ブジ

504

公開実用 昭和63-70149

デイスプレイパネルを例にとり説明する。液晶ディスプレイパネルへの駆動用IC1の実装は、第2図に示すごとく、TAB用テーブ2に、周知の方式、TAB(テーブ自動ポンデイング)方式にて行たわれ、これを第4図に示すごとく、周知にて行たわれ、これを第4図に示すごとく、周知になられて接合剤3で接合する。ここで接合剤3についているが、最近では、絶縁系の接着剤にでした。の実施では、絶縁系の接着剤、(たとえば、の実施のよる)、は、に関係を対している。とがは、電極群値の接触導通を接着剤にて固定する考え方にもとがいている。

また別な方法として、第3図に示すととく、アリント基板 4 に駆動用 I C 1 をワイヤボンデイングにて実装し、第5 図に示すどとく、フレキシブルブリント配線板 6 にて、前配と同様な方法で接合するものであつた。

[考案が解決しようとする問題点]

最近、液晶やBIを応用したデイスプレイパネルを用いて、文字あるいは画像を表示する機器組が急敵に増えてきている。これは、これらのデイスプレイパネルが、内壁を薄くでき、しかもを横でいる。といり優れた時でである。といりではない。しかして強いないながある。となるを増やするとは、デイスプレイパネルの駆動電極といりに増加するということになる。駆動電極、数の増加は、ディスプレイパネルを駆動するための駆動用ICの数も増える結果となる。

従つて、液晶ディスプレイパネル等の性能の何上を考えた場合、必然的に駆動用ICと、ディスプレイパネルとの接合点が増加し、なおかつ、接合電極群のピッチが小さくなり、接合の信頼性が低下するはかりか、実装コストへの影響が大きく実用化への大きな障壁となつている。

()

()

公開実用 昭和63-70149

では、従来方法で、テイスプレイパネルの性能 向上をはかれない嬰因を鯛べると、一番大きな要 因として、次のことを見い出した。つまり、接続 **化用いたフレキシブルプリント配組板 6、 又は、** TAB(テープ自動ポンデイング)用テープ2化 用いられている有機系フィルム8と、ディスプレ イパネルに用いられている電極ガラス9との無膨 **張が大きく異なるためと判つた。熱膨張係数で、** 電極ガラス9は、 αc = 4.0 × 1 0⁻⁶ であり、有 機系のフイルム B は、αι = 2 2 × 1 0⁻⁵ である。 この係収で、一ケタも異なるため、電気的接合部 **ル川わる烈ストレスは大きく、単なる接触で導通** のとられている構造では、とりてい耐えられるス トレスの範囲ではない。まして、性能向上を図る ため、接台ピッチが細くなつており、一本あたり の接触面横が小さくたつている。

当考案は、この激ストレスを大きく緩和させ、 信頼性特性を大巾に改善させよりとするものであ る。



[問題点を解決するための手段]

本考案は、半導体累子をTAB用テープ2に実 装した実装体を、他の電極群と接合する電極群の 接合構造において、前配電極群と接合する部分で TAB用テープ2からオーパーハング部15が、 電極群の外側まで伸ばして、熱ストレスを緩和さ せることを特徴とする電極群の接合構造である。

(作用)

作用について、具方性導電接着剤を用いて詳細 に解析したので説明する。

異方性導電接着剤を用いる場合は、熱圧者方式にて、ディスプレイパネルの電極ガラス?との接合を実施するが、前記したようにTAB用テープ2のポリイミド等有機系のフィルムBと、ソーダ系ガラス,石英ガラス等の電極ガラス?との熱に表かったが、熱圧治時にで、すでに接合部に歪が発生する。この歪は、幾存応力として接合後にも接合部に残つて、信頼性を低下させる。この幾存応力について、接合部に加わる域



()

()

公開実用 昭和63-70149

大応力を、有限要素法でモデルサンプル化で試算 してみた。結果を第6図化示す。

TAB用テープ2の有機系のフイルム8の厚さ によつて大きく差のあることが判り、有機系のフィルム8の薄い方が、幾存応力の小さいことが判 る。と同時に、有機系のフィルム8がないときの 接合部の幾存応力が、きわめて小さいことも推測 できる。冷熱時には、これと同様なストレスが、 さらに加わると考えられる。

有機系フイルム8の厚さによつて、電極ガラス 9 との接合抵抗の信頼性がどう変るかについても 調べた。試験の方法は、冷熱サイクル試験で行つ たが、有機系のフイルム8の厚さは、75μ、25μとし、第7図の凶中の0μと示されている のは、前記したオーバーハンクであり、詳細については、第1図に示してある。このTAB用テーブ 2 に用いられているフイルム8は125μである。結果については、第7図に示す。

第 7 図から判るように、有機系のフィルム 8 の 厚さ 0 μ (オーバーハング、つまり接合電極 1 1



が有機系のフイルム 8 から突出している状態)が 最も接合抵抗が安定している。構造としてオーバ -ハング構造が最も優れていることが判る。

第 8 凶で、有機系のフイルム 8 の厚さ、 2 5 μ の 6 のと、 0 μ (オーパーハンク) の 6 のは、 カ ラエポの曲げ破断による、接合抵抗のオーブン 6

公開実用 昭和63-70149

含まれているので、オープン歪の値も近よつている。しかし、ガラエボの破断歪がもつと大きければ、25 μとオーパーハングとの差はもつと顕著になつたと思われる。

又、この曲げストレスにおいて、第15図、第 16図に示すごとく、オーバーハング構造のもの は、TAB用テープ2側の接合電極11の曲りで、 接合部に加わるストレスを緩和している。第15 図、第16図は、サンブルのスケッチ図である。

これは、接合ビッチの細いものほどストレス緩和の効果が大きい。(接合電極11が細くなるため、曲げ強度が弱くなるためである。)第16図参照。

また、電極ガラス?と有機系のフィルム8の平面間隔は(第15図A,第16図B)ストレスを 経和する役目として大事であるが、この大きさは、 接合電極11の厚さ、巾に大きく関係している。 接合電極11が、太ければ大きくとり、細ければ 小さくてもよい。銅箔35μ厚のTAB用テープ である場合、A,BはQ5無以上あればほとんど



問題なく、信頼性が確保できる。

〔寒施例〕

次に、実施例について説明する。液晶ディスプレイパネルの電極ガラスタ上の電極12(第1図 参照)は、ITOで形成されてなり、その膜厚は 任ぼ500 $\frac{1}{4}$ (実際上100~5000 $\frac{1}{4}$ は可能) でシート抵抗は、約500 $\frac{1}{4}$ である。

一方、駆動用IC1をインナーリードポンディングしているIAB用テープ2は、有像系のフィルム8がポリイミド(カブトン)フィルムで厚さ125μ、網絡バターンは、55μ厚で、装面には、05μ厚のスズメツキが始されている。さらに網浴パターンの延長部分である接合電弧11はオーバーハングとなつて绕1図の前記フィルム8より左端側に突出している。

次に第9図を用いて手順について簡単に説明する。先ず、TABのオーパーハンク部の電極部と電極ガラス9の電極部における互いの接合部のゴミ、汚れを落とし、シート状の契方性導電接滑剤

公開実用 昭和63-70149

10を、電極ガラスタ上の電極12に、ロール又は、プレスにて貼り合せるか、強布する。次にTAB用テーブ2の接合電極11を、電極12に位置合せが終ると、非接着型をが終ると、非接合する。位置合せが終ると、非接合する。が必要がある。 10を、電極ガラスタンで、接合電極110に接着型でので、接合電極110に接着である。 11を電接押圧し、電極ガラスタの下面がからで、接合電極110に接着があるが、接合電極110に接着110に接着110に接着110に接着110に接着110に接着110に接着110に接着110に接着110に接近が変形されるか、接合電極110になる。

次に、與方性導電接着剤 1 0 が充分流れる時間 を待つてプレスアウトする。プレスアウトされた ものは、自然冷却により強固な接着が完了する。

接合電低11の表面は、スズメッキの他に半旧 メッキ。金メッキを検討したが、ほぼ同様を結果 である。又、異方性導電接着列10の貼り合せに ついても、電極ガラス9個に貼り合せる方法と、 TAB用テーツ2個に貼り合せる方法とがあるが、 これは、どちらも同等の結果であつた。

さらに各電極の接合ピッチについても、 0.3 ta . 0.2 5 ta . 0.1 9 ta の 3 種類で検討したが、同様の傾向であつた。

ポリイミドフイルム125μのTAB用テーア2で、パネル7との接合部をオーパハング構造として信頼性試験にて、接続抵抗の変化とともに、パネルモシュールを試作してその信頼性を評価した。その結果を現10凶~13凶に示す。

たお、別1図において、各級合電似11の先端には各接合電域を連結するために前記フイルム8の端部8aが設けられている。この端部8aは前記フイルム8(第1図の右端師)と調方を介して達していてもよく、又離別し別体となっていてもよい。この端部8aは前記接着到10から外れた平面に配置されている。第15図。第16図は、オーバーハング部15が示され、その下端には第10の如く端部8aを設けていないが、接合電極11を下方に延ばし、その下端に前記フィルム8の場部8aを形成してもよい。その場合、端部

()

公開実用 昭和63-70149

8 a が上方の前記フイルム 8 と両側方にて連結してもよく、又別離してもよい。この場合 8 a は前記接着削1 D に対し平面的にオーバーラップしないよう下方に形成するものとする。

[考案の効果]

従来の方法では、信頼性試験、たとえば、冷熱 試験では、100サイクル(モジュール状態で) 促版しかもたなかつたものが、3倍の300サイ クルまでもつようになり、パネルモジュールとし ての信頼性を大巾に改響した。

第14図には、接合抵抗による、従来方法と、 本考案による方法との比較が示してある。 これか らも判るように、れき然とした差がある。

第14図において、従来方法と、本考案の方法の差についてさらに説明をつけ加えるたらば、本 考案は、接合電極11を直接加圧圧着ツールにて 押しているのに対して、従来方法は、接合電極 11と加圧圧着ツールの間に有機系のフイルム8 が存在するために、異方性導電接着剤10中の導



電粒子が充分加圧を受けてつぶれていたいのである。本考案の方法では、充分つぶされており、その電極ガラス9と、接合電極11の間のきょりは、狭くなつて例えば4μ以下であり、又4μ以下とすることが、接合の信頼性を向上させている一因ともなつている。

4. 図面の簡単な説明

第1凶…本考案のTABを用いた電極接合構造 図。

第2図~第5図…従来技術を説明する接合構造 図。

第6回~第8回…本考案に至るまでの作用の説 明図。

第9四…本考案の実施についての手順を示す図。

第10図~第12図…本考案の信頼性特性図。

第13図…本考案を用いたモジュールの信頼性 説明図。

第14図…本考案と従来法の信頼性比較の一例 を示す凶。



公開実用 昭和63-70149

第15図,第16図…本考案におけるストレス 緩和の状態を示す図。

1 … 駆動用IC 2 … T A B用テープ

3 …接合剤

4 … ブリント基板

5 …ポンテインクワイヤ

6…フレキシブルプリント配線板

7 … パネル

8…有機系のフイルム(フイルム)

9…電極ガラス

10 … 與方性導電接滑削

1 1 … 接合電極 1 2 … 電極

13…モールド剤 1 4…銅パターン

15…オーパーハンク部

以上

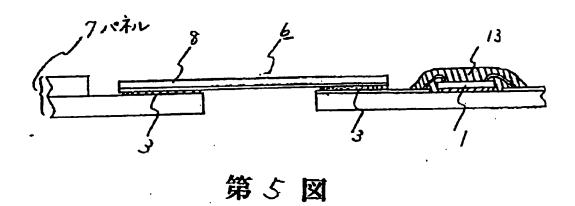
出願人 セイコーエブソン株式会社

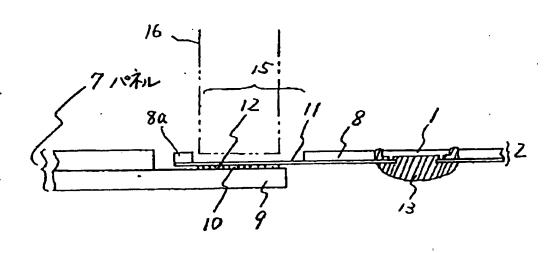
代理人 弁理士 上

517



1)





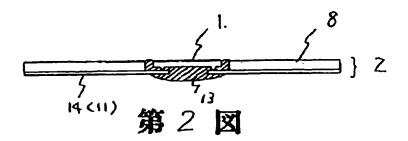
第/図

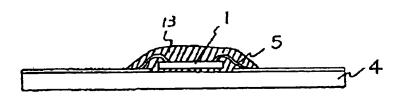
518

実開63-70145 (

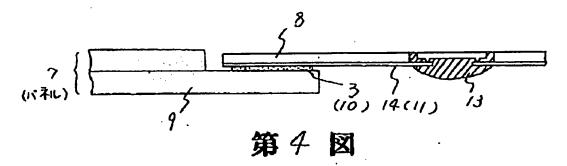
 \bigcirc

公開実用 昭和63-70149

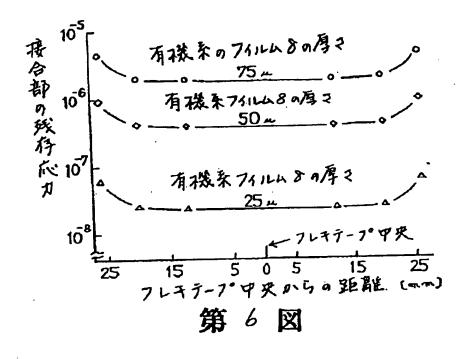


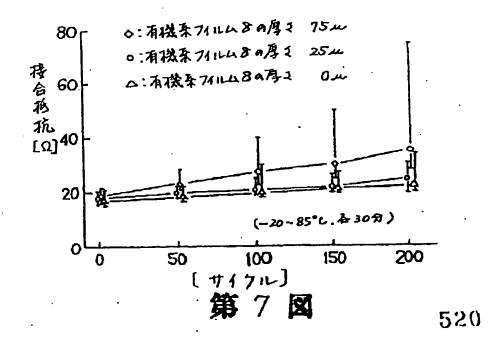


第3図



519



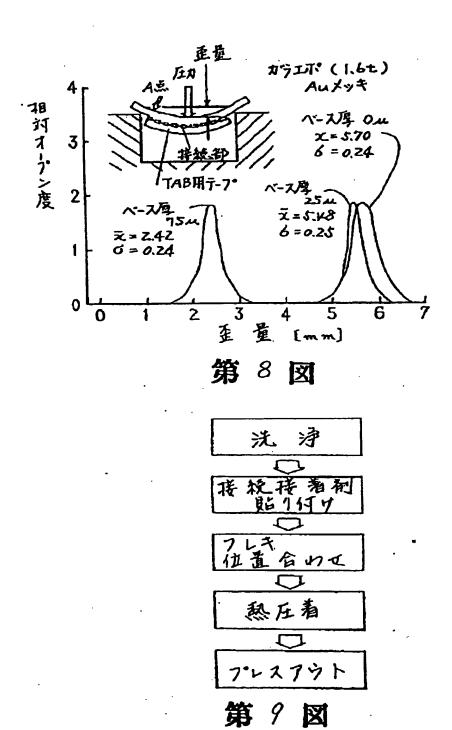


実開63~70545。

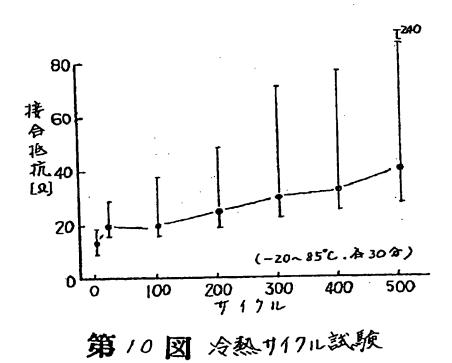
()

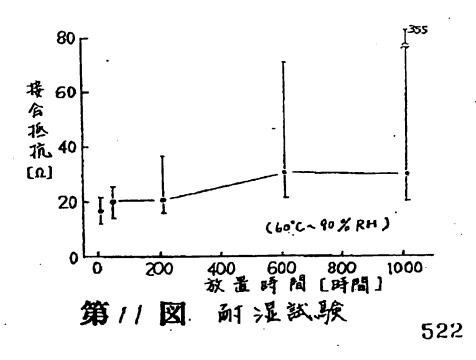
()

公開実用 昭和63-70149



521 実開63-70149。



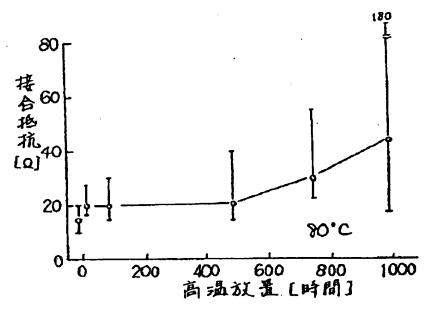


実開63-70119

 \bigcirc

()

公開実用 昭和63-70149

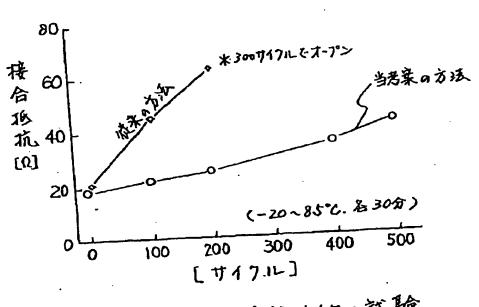


第12図 高温試験

試験項目	点灯不良
冷熱サイクル試験	0
(-20~85℃. 各30分) (300刊17ル)	17
耐湿試験	0
(60°C-90%RH)	<u>0.</u>
高温試験	70
(80°C)	0
(1000 H)	15

第13図 七汽-ルa信頼性

523 実**明63-70149**

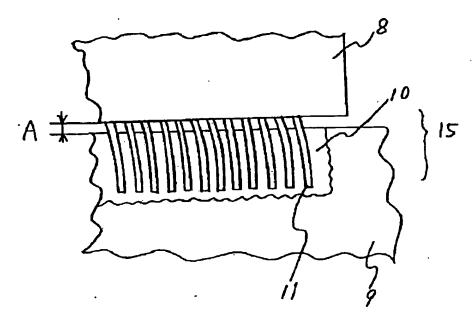


第14回冷熱サイクル試験

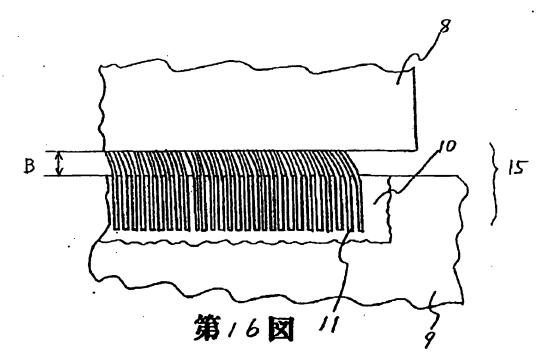
()

 \bigcirc

公開実用 昭和63-70149



第八の図



525 实现63-70149

UM-S63-70149

- (19) Japanese Patent Office (JP)
- (12) Publication of Laid-Open Utility Model Application (U)
- (11) Publication of Utility Model Application No. S63-70149
- (43) Publication May 11, 1988 (Showa 63)

Identification Symbol JPO file number (51) Int. Cl.⁴

6918-5F H 01 L 21/60

324 8205-2H G 02 F 1/133

C-6679-5F H 05 K 1/14

Request for Examination: Not required (Total pages)

- (54) Title of the Device: Joint Structure of Electrode Group
- (21) Japanese Utility Model Application No. S61-164539
- (22) Application October 27, 1986 (Showa 61)
- (72)Inventor Mitsumasa Sato 10

c/o Seiko Epson Corporation

3-3-5 Owa, Suwa-shi, Nagano

- (71)Applicant Seiko Epson Corporation
 - 2-4-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
- (74) Agent Patent Attorney Tsutomu Mogami and one other 15

UM-S63-70149

Specification

1. Title of the Device Joint Structure of Electrode Group

5 2. Scope of Claim for Utility Model Registration

A joint structure of an electrode group, characterized in that, in a joint structure of an electrode group for joining a mounting body in which a semiconductor element is mounted on a TAB tape to another electrode group, an overhang portion of a TAB tape extends outside an electrode group in a portion joined with the electrode group.

10

15

20

25

30

3. Detailed Description of the Device

[Field of Industrial Application]

The present device relates to a structure for joining electrode groups of a mounting body having a large number of electrodes (electrode group) to each other in a mounting body such as a display panel utilizing liquid crystal or EL.

[Prior Art]

A conventional structure is described using a display panel as an example with reference to FIGS. 2 to 5. Mounting of a driver IC 1 on a liquid crystal display panel is performed on a TAB tape 2 by a known method, a TAB (Tape Automated Bonding) method as shown in FIG. 2, and it is joined by a known joining agent 3 as shown in FIG. 4. Here, the joining agent 3 has been put into practical use such as solder or an anisotropic conductive adhesive. Recently, an embodiment of an insulating adhesive (for example, a UV curing adhesive, a thermosetting adhesive, or an instant adhesive) has been reported (The Technical Report of The Proceeding of The Institute of Electronics and Communication Engineers Vol. 85, No. 35 (1986.3)). This is based on an idea of stabilizing contact conduction between electrode groups with an adhesive.

Another method is to mount the driver IC 1 on a printed board 4 by wire bonding as shown in FIG. 3 and to join with a flexible printed wiring board 6 as shown in FIG. 5 by a similar method to that described above.

10

15

20

25

UM-S63-70149

[Problems to be Solved by the Device]

Recently, machinery for displaying characters or images by using a display panel which applies liquid crystal or EL has been rapidly increasing. This is because of nothing else that these display panels have excellent characteristics of having hidden potential for thin thickness and low price. However, it is necessary to increase the number of what is called a scanning line formed in these display panels, in the case of realizing sharper image or higher definition. Increasing the number of a scanning line also proportionately increases the number of a driver electrode of the display panel. The increase in the number of a driver electrode leads to increase also in the number of a driver IC for driving the display panel.

Therefore, a joint point of a driver IC and a display panel inevitably increases and a pitch of a joint electrode group becomes narrow. Then, reliability on joint decreases, and furthermore, effect on mounting cost becomes large, which becomes a barrier to practical application from a standpoint of improvement in performance of a liquid crystal display panel or the like.

The following is found as a major factor by examining a factor which prevents improvement in performance of a display panel according to a conventional method. It is found that that is because thermal expansivity of an organic film 8 used in the flexible printed wiring board 6 or a TAB (Tape Automated Bonding) tape 2 used for joint is significantly different from that of electrode glass 9 used in a display panel. A coefficient of thermal expansion of the electrode glass 9 is $\alpha_G = 4.0 \times 10^{-6}$ and that of the organic film 8 is $\alpha_f = 2.2 \times 10^{-5}$. Since the coefficients differ by one digit, thermal stress applied on an electric joint portion is heavy and is far beyond withstandable stress for a structure in which conduction is made by mere contact. Moreover, a joint pitch is made narrow to improve performance and contact area per line is made small.

The present device is to significantly relieve the thermal stress and drastically improve reliability characteristics.

30 [Means to Solve the Problem]

10

15

20

25

30

The present device is a joint structure of an electrode group, characterized in that, in a joint structure for joining a mounting body in which a semiconductor element is mounted on the TAB tape 2 to another electrode group, the overhang portion 15 is extended from the TAB tape 2 outside the electrode group in a joined portion with the electrode group to relieve thermal stress.

[Operation]

Operation is analyzed in detail using an anisotropic conductive adhesive and is described.

In the case of using an anisotropic conductive adhesive, joint with the electrode glass 9 of a display panel is performed by a thermocompression method. However, as described above, the coefficient of thermal expansion of the organic film 8 such as polyimide in the TAB tape 2 is significantly different from that of the electrode glass 9 such as soda glass or quartz glass. Therefore, distortion is already generated in thermocompression. The distortion remains in a joint portion as remaining stress even after joint to decrease reliability. As for the remaining stress, the maximum stress to be applied to the joint portion is calculated using a model sample by a finite element method. A result thereof is shown in FIG 6.

It is found that there is a great difference depending on a thickness of the organic film 8 in the TAB tape 2 and that a thinner organic film 8 has smaller remaining stress. At the same time, it can be supposed that remaining stress on the joint portion is extremely small when there is no organic film 8. It is conceivable that stress similar thereto is further applied in heating or cooling.

It is also examined how reliability of joint resistance to the electrode glass 9 changes depending on a thickness of the organic film 8. A test is performed by a heat cycle test, and a thickness of the organic film 8 is set 75μ and 25μ . What is denoted by 0 μ in FIG. 7 is the above describe overhang, detail of which is shown in FIG. 1. The film 8 used in the TAB tape 2 is $125~\mu$ in thickness. A result thereof is shown in FIG. 7.

As can be seen from FIG. 7, the organic film 8 having a thickness of 0 μ (the

10

15

20

25

30

UM-S63-70149

overhang, that is, a state in which a joint electrode 11 protrudes from the organic film 8) has the steadiest joint resistance. It is found that an overhang structure is the best structure.

Next, it is examined how much the overhang structure and another structure can withstand stress or are resistible. As an evaluation method, bending stress is applied to the joint portion to generate distortion. A flexible printed substrate in which a glass-epoxy copper-clad laminate having a thickness of 1.6 mm is entirely plated with gold and is then plated with tin is joined to the overhang TAB tape 2 with an anisostropic conductive adhesive 10. As shown in FIG. 8, pressure is applied to provide distortion for the joint portion of the glass-epoxy and the TAB tape 2 and the flexible printed board 6. Change in joint resistance at an A point is observed and the amount of distortion is measured when the joint resistance increases tenfold or more compared to the beginning (open). A result thereof is as shown in FIG. 8 In FIG. 8, the organic film 8 having a thickness of 25 μ and that of 0 μ (overhang) include "open" of joint resistance due to bending break of glass-epoxy; therefore, values of open distortion are close to each other. However, it is conceivable that the larger the break distortion of glass-epoxy is, the more significant the difference between 25 μ and the overhang is.

As for the bending stress, stress on the joint portion is relieved owing to bending of the joint electrode 11 on a side of the TAB tape 2 in the case of the overhang structure as shown in FIGS. 15 and 16. FIGS. 15 and 16 are sketch diagrams of a sample.

The narrower a joint pitch is, the larger an effect of relieving stress is. (This is because the joint electrode 11 is narrowed and bending strength is weakened.) Refer to FIG. 16.

A plane distance between the electrode glass 9 and the organic film 8 (A in FIG 15 and B in FIG 16) has an important role in relieving stress. The distance is largely related to a thickness and a width of the joint electrode 11. When the joint electrode 11 is wide, the distance is to be long, and when it is narrow, the distance may be short. In the case of a TAB tape that is copper foil having a thickness of 35 μ , A and B of 0.5 mm

10

15

20

25

UM-S63-70149

or more causes almost no problem and can secure reliability.

[Embodiment]

Next, an embodiment is described. An electrode 12 (ref. FIG. 1) over a electrode glass 9 of a liquid crystal display panel is made of ITO. A film thickness thereof is approximately 500 Å (may substantially be from 100 Å to 5000 Å), and sheet resistance is approximately 500 Ω .

On the other hand, a TAB tape 2 to which a driver IC 1 is bonded by an inner lead is a polyimide (Kapton) film having a thickness of 125 μ as an organic film 8 and a copper foil pattern having a thickness of 35 μ , whose surface is plated with tin to be 0.5 μ in thickness. A joint electrode 11 that is an extending portion of the copper foil pattern is to be an overhang and protrudes on a left end side of the above-described film 8 in FIG. 1.

Next, a procedure is briefly described with reference to FIG. 9. First, dust and dirt are cleaned in each joint portion in the electrode portion of the overhang portion of the TAB and in the electrode portion of the electrode glass 9. A sheet anisotropic conductive adhesive 10 is attached to an electrode 12 over the electrode glass 9 by rolling or press, or is applied. Then, the joint electrode 11 of the TAB tape 2 is aligned to the electrode 12. After alignment, pressure bonding is performed by a heating tool 16 on which non-bonding treatment is performed. As shown in FIG 1, the heating tool 16 directly presses the joint electrode 11 from above. Since a lower face of the electrode glass 9 is placed on a tool receiver, the joint electrode 11 is strongly pressed against the adhesive 10. Then, a metal particle (large quantity) mixed in the adhesive 10 transforms or cuts into the lower face of the joint electrode 11. Therefore, electric joint is secured.

Next, it is pressed out after enough time for the anisotropic conductive adhesive 10 to flow. After it is pressed out, strong bonding is completed with natural cooling.

It was examined to plate a surface of the joint electrode 11 with solder or gold in addition to tin, but a result thereof was similar. There were a method for bonding 30

10

15

25

30

UM-S63-70149

on a side of the electrode glass 9 and a method for bonding on a side of the TAB tape 2 to bond the anisotropic conductive adhesive 10, but results in both cases were similar.

Further, a joint pitch of each electrode was examined in three cases of 0.3 mm, 0.25 mm, and 0.19 mm, which resulted in a similar tendency.

A panel module is made as a sample to have an overhang structure in a joint portion with a panel 7, using the TAB tape 2 of a polyimide film of 125 μ . Then, reliability thereof was evaluated by a reliability test with change in joint resistance, results of which are shown in FIGS. 10 to 13.

Note that, in FIG 1, an end of each joint electrode 11 is provided with an edge portion 8a of the film 8 to couple each joint electrode. The edge portion 8a may be coupled to the film 8 (right end side in FIG. 1) through a side, or may be separated to be a separated body. The edge portion 8a is arranged on a plane off the adhesive 10. FIG 15 and FIG 16 show an overhang portion 15, and the lower end thereof is not provided with the edge portion 8a as shown in FIG 1; however, a joint electrode 11 may be extended downward and the edge portion 8a of the film 8 may be formed at the lower end thereof. In that case, the edge portion 8a may be coupled to the film 8 thereover on both sides, or may be separated. In this case, the 8a is formed below the adhesive 10 so as not to overlap planarly.

20 [Effect of Device]

A conventional method can withstand only approximately 100 cycles (in the form of a module) in a reliability test, for example, a thermal test, but reliability as a panel module is drastically improved to be able to withstand up to 300 cycles that is three times the conventional one.

FIG. 14 shows a comparison of joint resistance between a conventional method and a method according to the present device. As can be seen therefrom, there is an evident difference.

If further description is added on the difference between the conventional method and the present device in FG 14, the joint electrode 11 is pressed directly by a pressure bonding tool in the present device. Whereas, there is the organic film 8

20

between the joint electrode 11 and the pressure bonding tool in the conventional method; therefore, a conductive particle in the anisotropic conductive adhesive 10 is not deformed since sufficient pressure is not applied thereto. According to the method of the present device, it is sufficiently deformed. A distance between electrode glass 9 and the joint electrode 11 is narrowed, for example, 4 μ or less. Further, making it 4 μ or less contributes to improvement in joint reliability.

4. Brief Description of Drawing

/081-462702408=

FIG. 1 A diagram of an electrode joint structure using TAB of the present 10 device.

FIGS. 2 to 5 Diagrams of a joint structure showing a conventional technique.

FIGS. 6 to 8 Explanatory diagram of operation to the present device.

FIG 9 A diagram showing a procedure of an embodiment of the present device.

FIGS. 10 to 12 Diagrams showing reliability characteristics of the present device.

FIG. 13 An explanatory diagram of reliability on a module using the present device.

FIG. 14 A diagram showing an example of reliability comparison between the present device and a conventional method.

FIGS. 15 and 16 Diagrams showing a state of stress relaxation in the present device.

- 1 Driver IC
- 25 2 TAB tape
 - 3 joining agent
 - 4 Printed board
 - 5 Bonding wire
 - 6 Flexible printed wiring board
- 30 7 Panel

Agent Patent Attorney Tsutomu Mogami

and one other

15

UM-S63-70149

	8	Organic film (film)		
	9	Electrode glass		
	10	Anisotropic conductive adhesive	٠	
	11	Joint electrode		
5	12	Electrode		
	13	Molding agent		
	14	Copper pattern		
	15	Overhang portion		
10				•
			Applicant	Seiko Epson Cooperation